

2021年1月28日
一般財団法人日本規格協会

確認の申出に係る審議について

日本産業規格（以下、JIS という。）は、産業標準化法に基づき、JIS を制定又は確認若しくは改正した日から少なくとも5年を経過するまでに見直す必要があります。多数のJISがあることから効率的な運用のために、毎年度一括してJIS見直しを行うこととしております。JISの見直しの流れ及び産業標準作成委員会の審議方法は、別添1をご参照ください。

今回のご審議は、別添1の(3) JIS 確認の申出に係る審議です。

前回の基本分野産業標準作成委員会(2020年12月22日議決)でご承認いただいた、2021年度に見直し期限を迎える基本分野のJISのうち2021年度中の公示予定を「確認」とするJISについて、JSA ウェブサイトにJIS作成予定一覧表の公表を掲載し、利害関係者の意向を確認したところ、利害関係者からのご意見等はありませんでした。

この結果を踏まえて、別添2に、2021年度中の公示予定を「確認」とするJIS及び作成審議経過等を作成いたしましたので、これらのJISを「確認」としてよろしいか最終のご審議をお願いいたします。

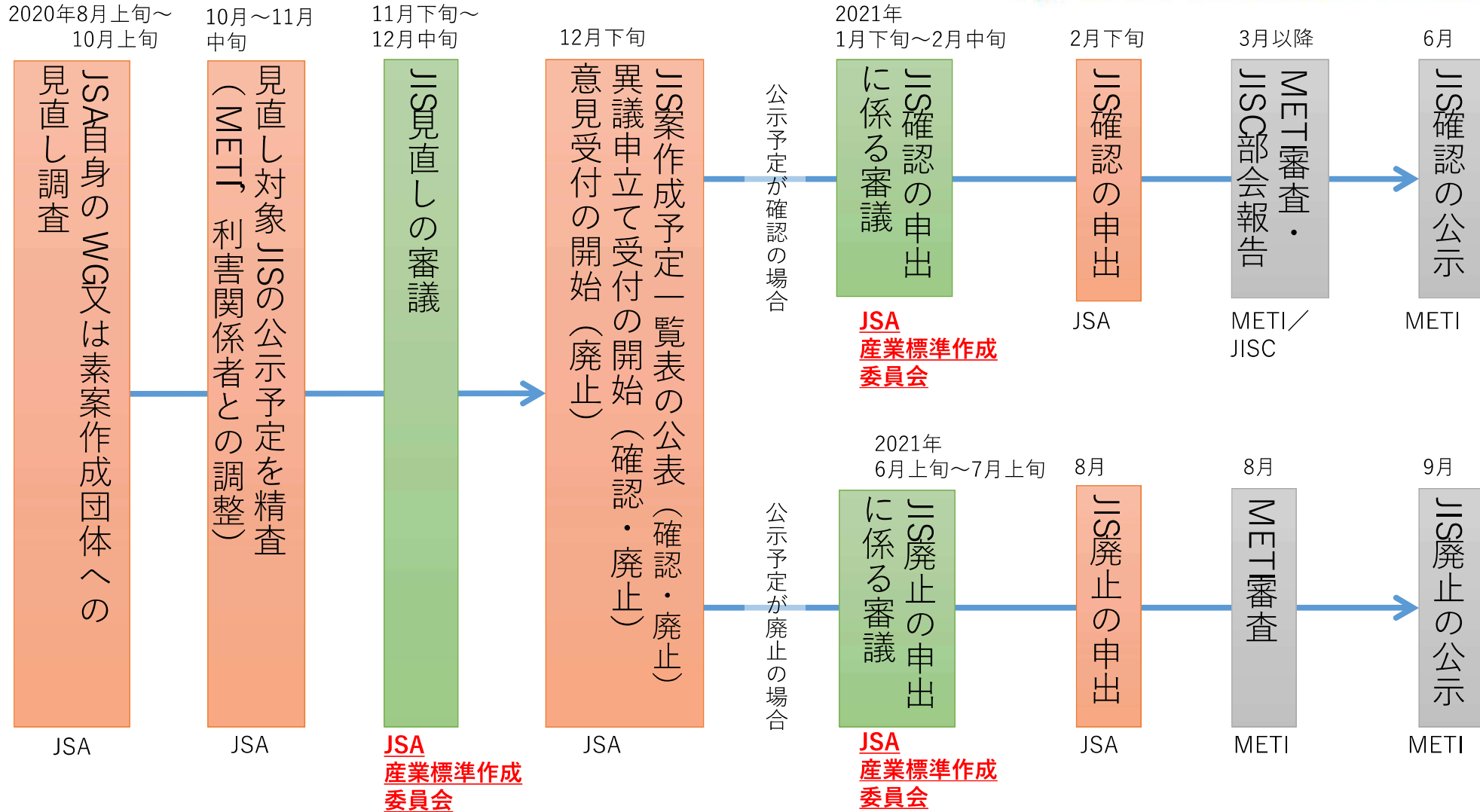
委員会において議決された場合には、産業標準化法第16条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき、主務大臣に申出いたします。

なお、字句等編集上の修正については、産業標準作成委員会事務局に一任いただきますようお願いいたします。

注記 JIS 法令上、別添2別紙2の3. ②JIS作成予定一覧表の公表、③利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保及び④異議申立ての機会の確保は、主務大臣に対して申出を行うまでの過程において行うこととしております。現時点では、利害関係者からのご意見等はありませんが、審議中又は審議後に意見等があった場合で、議決結果の変更又は意見等を採用しない場合は、再度、産業標準作成委員会にお諮りいたします。

JISの見直しに関する審議

(1) JIS見直しの流れ



(2) JIS見直しの審議について

目的： 次年度に5年見直し期限を迎えるJISについて、「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの見直し方針を決定します。

1. 利害関係者の意見を確認するため、JSAが見直し対象のJISを抽出し、調査します。
 - ※ 見直し対象は、次年度に5年見直し期限を迎えるJISです。
 - ※ 技術的動向、対応国際規格や引用規格の改正・廃止などを背景に、JISを改正する必要があるのか、確認でよいのか、又は廃止するかなどを調査します。

(2) JIS見直しの審議について (続き)

2. JSAが調査結果に基づき、それぞれのJISについて「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの案（以下、JIS見直し案という。）を理由とともに作成します。
 その際には、必要に応じて、JSA自身のWG又は素案作成団体に事実確認を行います。
 その後、産業標準作成委員会にお諮りします。
- ※ 当該JISが次に該当し、次年度までに「改正」又は「廃止」の公示を予定している場合は、JIS見直し案を「改正」又は「廃止」とします。
 - ※ 当該JISが次に該当し、これから改正又は廃止に着手するため、次年度までに「改正」若しくは「廃止」の公示ができない場合、又は次に該当しない場合は、JIS見直し案を「確認」とします。

改正又は廃止が必要な要因
市場実態又は技術動向に合わせ、最適な技術内容とすべく、規定内容の変更が必要
社会的要因で規定内容の変更が必要（環境問題など）
対応国際規格の改正又は廃止があり、規定内容の変更が必要
対応すべき国際規格が新たに制定され、それに整合することが必要
引用規格の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
引用すべきJISが新たに制定された
整合すべき（参照している）法規の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
整合すべき（参照している）すべき法規が新たに制定された
技術の陳腐化・利用の縮小等、JISの廃止が妥当

(2) JIS見直しの審議について (続き)

3. 産業標準作成委員会でJIS見直し案をご審議いただきます。
 - ※ JIS見直し案の資料については、JSAで事実確認を行っております。
 - ※ 対応国際規格などの改廃状況は、資料2別添2の参照文書（JSA調査結果）に記載しております。
 - 例 対応国際規格が「×」で、JIS見直し案の公示予定を「確認」としている場合、(2) 2. の「対応国際規格の改正又は廃止があり、規定内容の変更が必要」に該当していないことをJSAで確認しています。
 - ※ ご承認いただいたJIS見直しのうち、公示予定が「確認」及び「廃止」のJISは、JIS作成予定一覧表としてJSAホームページに掲載します。
(利害関係者に対する産業標準作成委員会への参加の機会の確保及び異議申立ての機会の確保のため)

(3) JIS確認の申出に係る審議

目的： 利害関係者の意向を適切に反映するためのプロセスを経て、主務大臣にJISの確認の申出をしてよいかどうかを決定します。

1. 「確認」のJIS作成予定一覧表の公表によって、利害関係者の意向を確認した後、JSAが日本産業規格作成審議経過報告書（確認）を作成します。

※ 当該報告書では、確認の申出を行う対象JIS、確認する理由、認定機関としてのプロセスの結果（JIS見直しの審議～JIS作成予定一覧表の公表の結果）を示しております。

2. 産業標準作成委員会で日本産業規格作成審議経過報告書（確認）に基づき、ご審議いただきます。

※ JIS見直しの審議の結果から変更がある場合は、JSAからその旨産業標準作成委員会にご報告いたします。

3. 産業標準作成委員会で承認されたJISは、JSAから主務大臣へJISの確認の申出を行います。

日本産業規格作成審議経過報告書（確認）

1. 確認の申出を行う日本産業規格

JIS C 2560-2 フェライト磁心—第2部：試験方法 外56件（別紙1のとおり）

2. 確認の申出を行う日本産業規格に係る主務大臣

経済産業大臣専管

3. 確認の理由

別紙1の日本産業規格は、産業標準化法第17条の規定による見直し期限を2021年度に迎えるものであるが、認定産業標準作成機関として、関係各方面の意見を調査し検討した結果、現行の日本産業規格がなお適正であると認められることから、確認すべきものとして申出する。

4. 確認の申出を行う日本産業規格の作成及び審議に関する事項

- (1) 認定産業標準作成機関名；一般財団法人日本規格協会（JSA）
- (2) 法令上の区分；
産業標準化法第16条において準用する同法第14条第1項に基づく申出
- (3) 産業標準作成委員会名；
電子分野産業標準作成委員会
- (4) 産業標準作成委員会の委員構成表及び開催状況；
別紙2に記載のとおり。
- (5) 作成審議経過
別紙2に記載のとおり。

以上

確認の申出を行う日本産業規格

No.	規格番号	規格名称
1	C2560-2	フェライト磁心—第2部：試験方法
2	C2560-3	フェライト磁心—第3部：寸法及び外観異常
3	C2560-3-1	フェライト磁心—第3-1部：寸法及び外観—E形フェライト磁心
4	C5270	電子機器用コンデンサ及び抵抗器—軸操作形部品の操作軸、取付ねじ及び取付孔の形状並びに推奨寸法
5	C5402-12-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-1部：はんだ付け試験—試験12a：はんだ付け性、ぬれ（ウェットティング）、はんだ槽法
6	C5402-12-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-2部：はんだ付け試験—試験12b：はんだ付け性、ぬれ（ウェットティング）、はんだこて法
7	C5402-12-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-4部：はんだ付け試験—試験12d：はんだ耐熱性、はんだ槽法
8	C5402-12-5	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-5部：はんだ付け試験—試験12e：はんだ耐熱性、はんだこて法
9	C5402-22-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第22-1部：静電容量試験—試験22a：静電容量
10	C5402-8-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第8-2部：静的な力試験（固定形コネクタ）—試験8b：静的な力、軸方向
11	C5504	ホーンスピーカ
12	C5630-1	マイクロマシン及びMEMS—第1部：マイクロマシン及びMEMSに関する用語
13	C5630-6	マイクロマシン及びMEMS—第6部：薄膜材料の軸荷重疲労試験方法
14	C5750-3-1	ディペンダビリティ管理—第3-1部：適用の指針—ディペンダビリティ解析手法の指針
15	C5877-2	偏光子試験方法
16	C5914-3	光伝送用サーキュレータ—第3部：シングルモード光ファイバピグテール形光サーキュレータ
17	C5920-3	光伝送用パワー制御受動部品—第3部：シングルモード光ファイバピグテール形電気制御式可変光減衰器
18	C5948	光伝送用半導体レーザモジュールの信頼性評価方法
19	C5953-1	光伝送用能動部品—性能標準—第1部：総則
20	C5953-7	光伝送用能動部品—性能標準—第7部：GPON用光トランシーバ
21	C5954-4	光伝送用能動部品—試験及び測定方法—第4部：GPON用光トランシーバ
22	C5955-1	光伝送用能動部品—性能標準テンプレート—第1部：単心直列伝送リンク用光送・受信モジュール
23	C5965-2-1	光ファイバコネクタ光学互換—第2-1部：シングルモード直角PC端面光ファイバ光学互換標準の指針
24	C5965-2-2	光ファイバコネクタ光学互換—第2-2部：シングルモード斜めPC端面光ファイバ光学互換標準の指針
25	C5965-2-4	光ファイバコネクタ光学互換標準—第2-4部：基準接続用シングルモード直角PC端面光ファイバの接続パラメータ
26	C5965-2-5	光ファイバコネクタ光学互換標準—第2-5部：基準接続用シングルモード斜めPC端面光ファイバの接続パラメータ
27	C5965-3-1	光ファイバコネクタ光学互換—第3-1部：シングルモード光ファイバ用直径2.5mm及び1.25mm円筒形全ジルコニア直角PC端面フェルルール光学互換標準

28	C5965-3-2	光ファイバコネクタ光学互換—第3-2部：シングルモード光ファイバ用直径2.5mm及び1.25mm円筒形全ジルコニア8度斜めPC端面フェルール光学互換標準
29	C6101-2	テレビジョン受信機試験方法 第2部：音声チャンネル—モノラルチャンネルの電氣的測定と一般的方法
30	C6101-3	テレビジョン受信機試験方法 第3部：副搬送波方式使用の音声多重テレビジョン受信機の電氣的測定
31	C61191-6	プリント配線板実装—第6部：BGA及びLGAのはんだ接合部のポイド評価基準及び測定方法
32	C6122-10-3	光増幅器—測定方法—第10-3部：マルチチャンネルパラメータ—プロープ法
33	C6122-10-5	光増幅器—測定方法—第10-5部：マルチチャンネルパラメータ—分布ラマン増幅器の利得及び雑音指数
34	C6122-3-1	光増幅器—測定方法—第3-1部：雑音指数パラメータ—光スペクトラムアナライザ法
35	C6122-3-3	光増幅器—測定方法—第3-3部：雑音指数パラメータ—信号対総ASEパワー比
36	C6185-1	オプティカルタイムドメインリフレクトメータ（OTDR）—第1部：試験方法
37	C6187-1	光波長計—第1部：試験方法
38	C6870-3	光ファイバケーブル—第3部：屋外ケーブル—品種別通則
39	C61280-1-3	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第1-3部：中心波長及びスペクトル幅測定
40	C61280-2-10	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第2-10部：レーザ送信器の時間分解チャープ及びアルファファクタ測定
41	C61280-2-2	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第2-2部：光アイパターン、光波形及び消光比測定
42	C61300-2-22	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-22部：温度サイクル試験
43	C61300-2-47	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-47部：熱衝撃試験
44	C61300-2-49	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-49部：取付け済み光ファイバコード付き光ファイバコネクタプラグの曲げ試験
45	C61300-2-50	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-50部：光ファイバクランプ強度試験—非通光左右曲げ引張り
46	C61300-2-51	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-51部：光ファイバクランプ強度試験—通光左右曲げ引張り
47	C61300-3-14	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-14部：可変光減衰器の減衰量の設定の誤差及び再現性測定
48	C61300-3-2	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-2部：シングルモード光デバイスの光損失の偏光依存性
49	C61300-3-4	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-4部：損失測定
50	C61300-3-47	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-47部：干渉法による直角PC端面及び斜めPC端面単心円筒形フェールの端面形状測定
51	C62024-2	高周波誘導部品—電氣的特性及び測定方法—第2部：DC/DCコンバータ用インダクタの定格電流の決め方
52	C62137-1-3	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-3部：繰返し落下試験方法
53	C62137-1-4	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-4部：繰返し曲げ試験方法

54	C62137-1-5	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第 1 - 5 部 : せん断疲労試験方法
55	C62246-1	リードスイッチ—第 1 部 : 品目別通則
56	C62246-1-1	リードスイッチ—第 1 - 1 部 : 品質評価及び試験方法
57	C62813	電気・電子機器用リチウムイオンキャパシタ—電気的特性の試験方法

1. 産業標準作成委員会の委員構成表

1. 1 電子分野産業標準作成委員会

	氏名	所属	種別
(委員長)	波多腰 玄一	早稲田大学	中立者
(委員)	天野 佑基	総務省国際戦略局通信規格課	
	平本 俊郎	東京大学	
	藤井 哲郎	東京都市大学	
	渋谷 隆	株式会社白山	生産者
	諏訪 正樹	KOA 株式会社	
	内藤 恵美子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・ コンサルタント・相談員協会	使用者
	松井 隆	日本電信電話株式会社	
	石井 紀彦	日本放送協会	
河村 真紀子	主婦連合会		
(関係者)	後藤 博幸	経済産業省産業技術環境局国際電気標準課	—
(事務局)	中川 梓	一般財団法人日本規格協会	
	山本 久義	一般財団法人日本規格協会	
	清水 祐貴	一般財団法人日本規格協会	

2. 委員会開催状況

開催年月日	委員会区分	出席者数又は回答者数(名)
2020年12月18日	産業標準作成委員会	10/10
2021年2月12日(予定)	産業標準作成委員会	〇/10

3. 作成審議経過

- ①産業標準案作成対象テーマの審議（JIS 見直しの審議）；
2020年12月18日 産業標準作成委員会議決
- ②JIS 作成予定一覧表の公表；
2020年12月25日～申出予定日（2021年2月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載
- ③利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保；
2020年12月25日～申出予定日（2021年2月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載
- ④異議申立ての機会の確保；
2020年12月25日～申出予定日（2021年2月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載
- ⑤産業標準案の作成及び審議（JIS 確認の申出に係る審議）；
2021年2月12日（予定） 産業標準作成委員会議決
- ⑥議事録及び委員会資料の公開；
2021年2月下旬（予定） JSA ウェブサイト掲載

4. 利害関係者の産業標準作成委員会への参加に関する内容

参加： 無

5. 異議申立てに関する内容及び結果

異議申立ての有無： 無